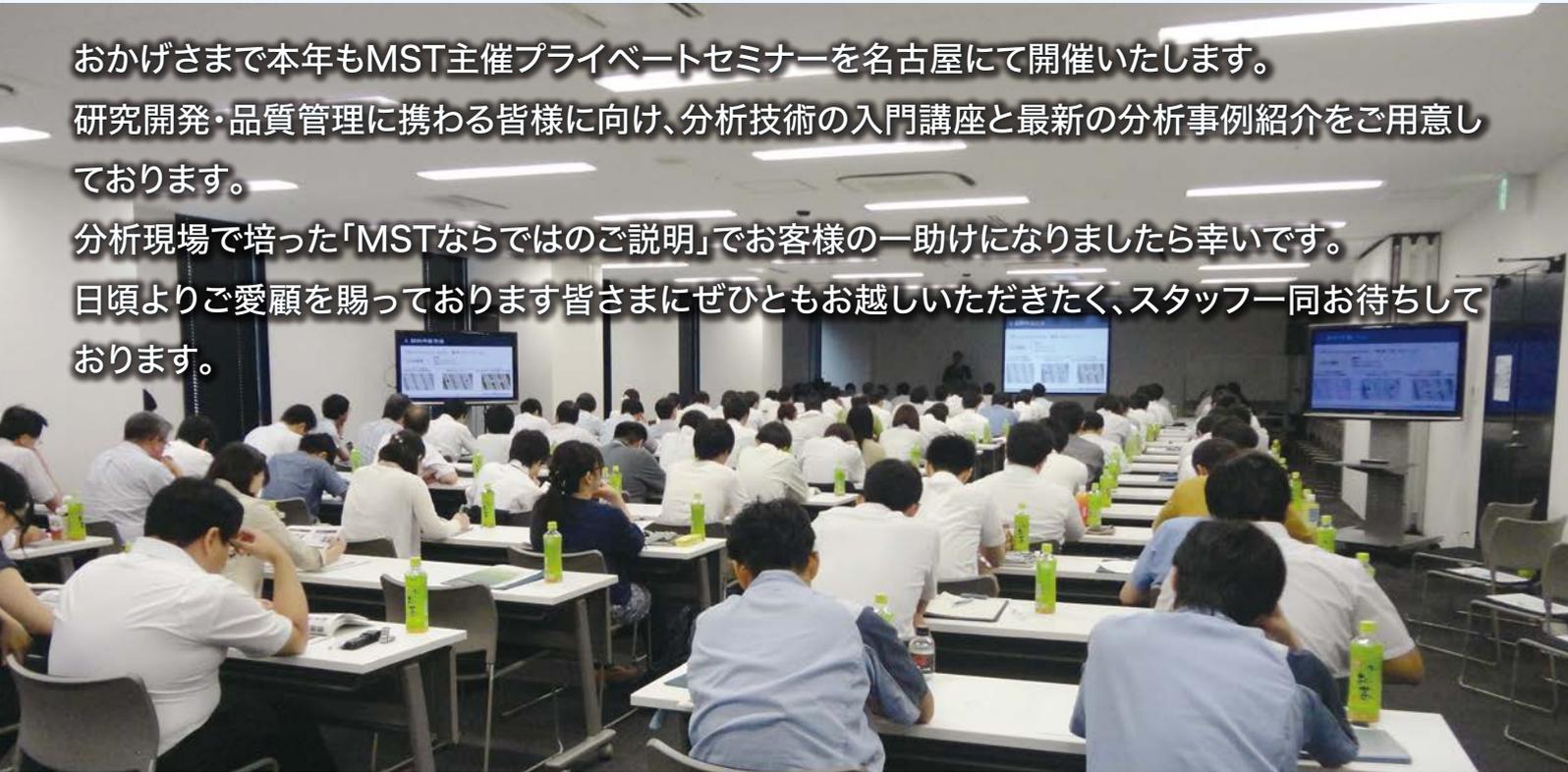


MSTプライベートセミナー in 名古屋

～分析の基礎から最新の分析事例までのご紹介～

おかげさまで本年もMST主催プライベートセミナーを名古屋にて開催いたします。
 研究開発・品質管理に携わる皆様に向け、分析技術の入門講座と最新の分析事例紹介をご用意しております。
 分析現場で培った「MSTならではのご説明」でお客様の一助けになりましたら幸いです。
 日頃よりご愛顧を賜っております皆さまにぜひともお越しいただきたく、スタッフ一同お待ちしております。



開催日時

2019年8月1日(木)

セミナー開始10:30(受付開始10:00～)閉場18:00

※開催時間の入退室はご自由に行えます。
 お好きなタイトルのみ聴講いただけます。

開催場所

ウインクあいち(愛知県産業労働センター)5階 小ホール2

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

ウインクあいち(愛知県産業労働センター)

アクセス

<http://www.winc-aichi.jp/access/>

- 本イベントは定員制のため、申し込み多数の場合はご希望に沿えない場合がございます。
- 同業の分析会社、及びその関連会社の方は、お申し込みをお断りしております。
 あらかじめご了承ください。

お申込み

- 参加費は無料です。
- 下記URLよりお申し込みください。
<https://www.ext-web.net/mst/seminar2019nagoya/>
- お申し込みの無い方の入場はお断りさせていただく場合がございます。

ご来場特典

- 分析料金10%割引チケット
 分析のご依頼時にぜひご利用ください。
 ※他の割引との併用は出来ません。

一般財団法人
MST 材料科学技術振興財団

MSTプライベートセミナー運営事務局
 東京都世田谷区喜多見1-18-6
 TEL:03-3749-2525(東京)・052-586-2626(名古屋)
 メール:mst-news@mst.or.jp



MSTの分析技術を、多くの事例をもとにご紹介します。

午前は「新製品コーナー」として、AIを活用した分析に加え、非破壊検査、GaN系デバイス等の分析事例を解説。

午後は入門編として分析手法ごとの基礎講座と、最新の分析事例をご紹介します。

分析に馴染みの無い方から最新情報を知りたい方まで、幅広い講演をご用意しております。

10:00~10:30	受付・開場	
10:30~10:45	ご案内	主催者ご挨拶
10:45~11:00		分析手法の選択
11:00~11:20	新製品コーナー	AIを活用した分析事例紹介 Part3
11:20~11:25		質疑応答
11:25~11:45		非破壊分析の事例 ~新規導入クライオX線CT測定~
11:45~12:00		高機能自動化SIMSの導入とGaN系デバイス等の分析事例
12:00~13:00	受付・質疑応答&お昼休み	
13:00~13:20	分析技術入門	一問一答 微小部解析技術の入門編・分析事例(SEM・Slice&View) CHECK!
13:20~13:40		一問一答 微小部解析技術の入門編・分析事例(TEM・STEM) CHECK!
13:40~13:50		質疑応答
13:50~14:10		一問一答 表面分析技術の入門編・分析事例(SIMS・TOF-SIMS) CHECK!
14:10~14:30		一問一答 表面分析技術の入門編・分析事例(XPS・XAFS) CHECK!
14:30~14:50	質疑応答&休憩	
14:50~15:10	最新分析事例 (エレクトロニクス ・工業分野)	SNDMによるキャリア分布評価事例紹介 LSI、パワー半導体から強誘電体材料まで
15:10~15:30		故障解析と電子顕微鏡等を用いた積層セラミックコンデンサの分析事例
15:30~15:50		電子顕微鏡による記憶素子の分析事例紹介
15:50~16:10	質疑応答&休憩	
16:10~16:30	最新分析事例 (有機分析)	有機材料の劣化による変色調査(ポリウレタンの黄変等)
16:30~16:50		クライオSEMによるソフトマテリアルの構造観察
16:50~17:10		ライフサイエンス分野と経皮吸収の複合分析(高機能TOF-SIMS)
17:10~18:00	全体質問&ポスター展示・分析相談(Q&A)	

CHECK! 一問一答とは?

MSTの分析担当者がお客さまからよく寄せられるお問い合わせ内容を「Q&Aのプレゼン」形式でお答えいたします。

皆様の疑問を解決いたします!

【一問一答】

Q: TOF-SIMS と SIMS の違いって何ですか?

A: 答えはセミナーにてお答えします



MST 分析担当者